

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.
H01L 21/66

(11) 공개번호
(43) 공개일자

특1990-0013608
1990년09월06일

(21) 출원번호 특1989-0002458

(22) 출원일자 1989년02월28일

(71) 출원인 도오교오 에레구토론 가부시끼가이샤, 고다까 토시오
일본

(72) 발명자 일본국 도오교오도 신쥬구구 니시신쥬구 1초오메 26반 2고
이또야마 타케도시

(74) 대리인 일본
일본국 도오교오도 신쥬구구 니시신쥬구 1초오메 26반 2고 도오교오 에레구토론 가부시끼가이샤 내
강동수

(77) 심사청구 강일우

(77) 심사청구 없음

(54) 출원명 프로우버 장치

요약

내용 없음

대표도

제3

경세서

[발명의 명칭]

종로우버 장치

[도면의 간단한 설명]

제 3도는 본 발명의 데스트 헤드 얹어씌는형 웨이퍼 프로우버 장치를 부분적으로 나타낸 도면,

제 4도는 본 발명의 프로우버 장치에 사용되는 데스트 헤드 프로우브 카아드의 다른 형태를 나타낸 도면,

제 5도는 본 발명의 웨이퍼 프로우버 장치의 동작을 설명하기 위한 도면.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

청구의 범위

청구항 1.

데스트 신호를 발생하는 데스트 헤드 수단(26)과, 상기 데스트 헤드 수단(26)에 붙이고 떼기가 자유롭게 고정되고, 데스트 피스와 전기적으로 접촉함으로써, 상기 데스트 피스에 상기 데스트 신호를 입력하며, 상기 데스트 피스의 전기적 특성을 데스트 하기 위한 프로우브 카아드 수단(32)으로 이루어지는 프로우버 장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 프로우브 카아드 수단(32)이, 상기 데스트 헤드 수단(26)에 나사멈춤 되어 있는 프로우버 장치.

청구항 3.

데스트 해야 할 반도체 웨이퍼를 얹어놓는데(37a)가 형성된 프로우브 기구부(22)와, 상기 웨이퍼와 전기적으로 접촉함으로써 상기 웨이퍼의 전기적 특성을 데스트하기 위한 프로우브 열이 형성된 프로우브 카아드 수단(32)과 데스터의 지령에 의하여 데스트 신호를 발생하고, 이것을 상기 프로우브 카아드(32)를 통하여 상기 웨이퍼에 입력되는 데스트 헤드(26)로서, 상기 데스트 헤드(26)는, 상기 프로우브 카아드 수단(32)을 붙이고, 떼기가 자유롭게 고정함과 동시에 이것과 전기적으로 접속하고 있고 또한, 상기 웨이퍼와 프로우브 카아드(32)와의 위치 맞춤을 행하기 위한 위치맞춤기구(37)로 이루어져서, 반도체 웨이퍼에 형성된, 칩의 전기적 특성을 데스트 하기 위한 프로우버 장치.

청구항 4.

제 3항에 있어서, 데스트 헤드(26)는, 그의 아래면에, 상기 프로우브 카아드(32)를 직접 고정하고, 이것과 직접 전기적으로 접속하는 퍼포먼스 보오드(31)를 가지는 프로우버 장치.

청구항 5.

제 4항에 있어서, 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 상기 프로우브 카아드 수단(32)은, 나사(33)에 의하여 고정되어 있는 프로우버장치.

청구항 6.

제 4항에 있어서, 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 상기 프로우브 카아드 수단(32)는, 배선 커넥터(34)에 의하여 고정되어 있는 프로우버장치.

청구항 7.

제 4항에 있어서, 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 프로우브 카아드 수단(32)는, 포고 핀(34)에 의하여 전기적으로 접속되어 있는 프로우버장치.

청구항 8.

제 5항에 있어서, 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 상기 프로우브 카아드 수단(32)는, 각각 콘택트 패드(41),(42)를 가지고, 이들 콘택트 패드(41), 42)의 접촉에 의하여 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 프로우브 카아드 수단(32)가 전기적으로 접속하는 프로우버 장치.

청구항 9.

제 3항에 있어서, 상기 위치맞춤 기구(37)는, 상기 프로우브 카아드 수단(32)을 이동시키지 않고, 얹어놓는데(37a)를 X,Y,z 및 θ 방향으로 이동시키는 프로우버 장치.

청구항 10.

제 3항에 있어서, 상기 테스트 헤드(26)는, 상기 프로우브 기구부(22)의 상부에 대하여 위치 되었을때에 프로우브 카아드 수단(32)가 웨치퍼와 접촉하도록 프로우브 기구부(22)에 회전운동이 자유롭게 설치되어 있는 프로우버 장치.

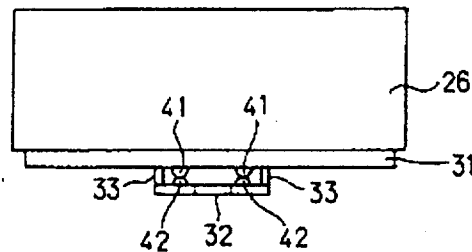
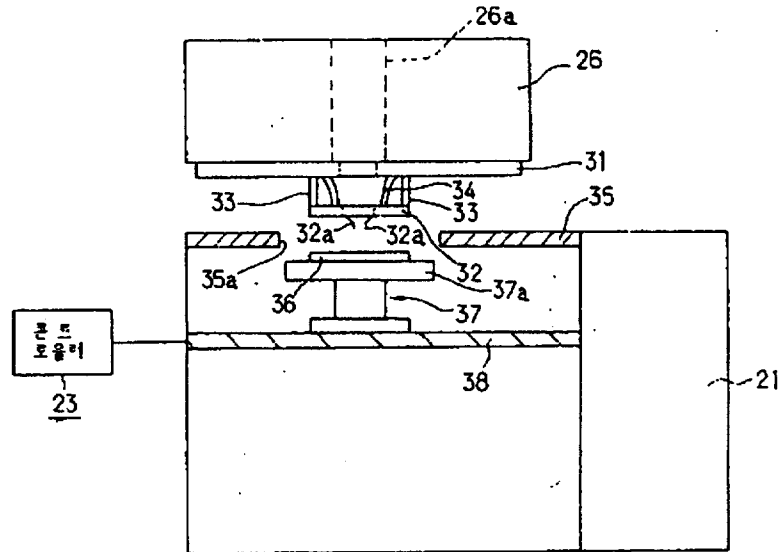
청구항 11.

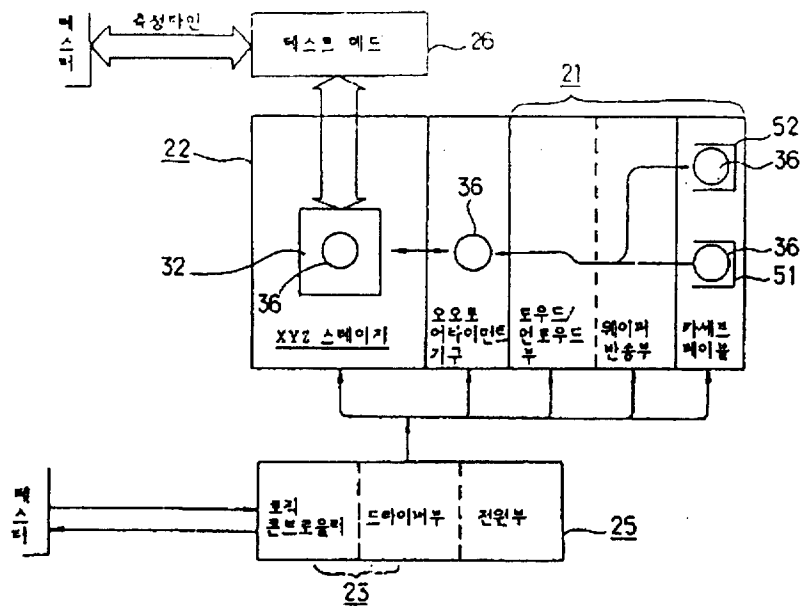
제 3항에 있어서, 상기 테스트 헤드(26)는, 핀 일렉트로닉스보오드를 수용하기 위한 호울(26a)을 가지고, 그 호울(26a)의 앞쪽끝단이 돌출하고, 그 돌출부에 프로우브 카아드 수단(32)가 고정되어 있는 프로우버장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면 3





2000년 11월 15일

2000년 11월 15일